

*ООО «Электростекло» контролирует пропускание материалов для различных оптических изделий (окна, пластины, линзы, плоские и сферические зеркала, призмы), используя спектрофотометр СФ-56 и инфракрасный Фурье спектрометр Bruker Tensor 27*

Предлагаем вам услуги регистрации пропускания полированных образцов (окон, пластин) из различных материалов на наших спектральных приборах: спектрофотометр СФ-56 в диапазоне (190-1100) нм и ИК-Фурье спектрометр Bruker Tensor 27 в диапазоне (2.5-25.0) мкм. По желанию заказчика возможно изготовление полированных образцов материалов, требуемых для измерения спектрального коэффициента пропускания. Кроме того, возможно измерение коэффициента отражения зеркал в спектральном диапазоне (2.5 - 25.0) мкм под заданным углом падения излучения на зеркало.

## 1. ИК-Фурье спектрометр Bruker Tensor 27



Характеристика	Значение
Спектральный диапазон измерений, мкм	(2.5 - 25.0) мкм
Диапазон измерения коэффициентов пропускания, %	(0,01-100)%

Габариты оптических окон, пластин или полированных образцов материалов, коэффициент пропускания которых возможно прописать на данном спектрометре Bruker Tensor 27, следующие: диаметр от 20 мм до 40 мм и толщина до 10 мм.

Габариты зеркал, коэффициент отражения которых возможно измерить на спектрометре данной комплектации, следующие: диаметр от 30 мм до 50 мм и толщина до 50 мм. При этом измерение коэффициента отражения зеркал осуществляется под заданным углом падения излучения на зеркало от 10° до (~90°).

## 2. Спектрофотометр СФ-56



Характеристика	Значение
Спектральный диапазон измерений, нм	(190 - 1100) нм
Диапазон измерения коэффициентов пропускания, %	(0,01-100) %
Фотометрическая точность при измерении коэффициентов пропускания, %	В диапазоне 400-750 нм: ±0,5% для 30% - 100%; ±0,25 для 1% - 30%; в остальном спектральном диапазоне ±1,0%
Фотометрическая воспроизводимость при измерении коэффициентов пропускания, %	0,01 %
Погрешность установки длин волн, нм	±1,0 нм
Наименьший разрешаемый спектральный интервал, нм	0,3 нм

Габариты оптических окон, пластин или полированных образцов материалов, коэффициент пропускания которых возможно прописать на данном спектрометре СФ-56, следующие: диаметр от 20 мм до 60 мм и толщина до 30 мм.

Предлагаем вам проверку пропускания в спектральных диапазонах (190-1100) нм и (2.5-25.0) мкм образцов следующих оптических материалов: стекло К8, цветное стекло, кварцевое стекло (кварц КУ 1, кварц КИ, кварц КВ), кристаллы (сапфир Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, кремний Si, германий Ge, селенид цинка ZnSe, CaF<sub>2</sub> (фтористый кальций, флюорит), BaF<sub>2</sub> (фтористый барий), MgF<sub>2</sub> (фтористый магний), LiF (фтористый литий) и другие, в том числе материалы заказчика.

Просим присылать ваши запросы по электронной почте [sales@elektrosteklo.ru](mailto:sales@elektrosteklo.ru) или по факсу +7 (910) 485 67 82.